

課題番号 : F-17-HK-0038  
利用形態 : 技術相談  
利用課題名(日本語) : 金属酸化膜の光学特性評価  
Program Title (English) : Annealing of functional metal oxide thin film to crystallize  
利用者名(日本語) : 上野康正<sup>1)</sup>  
Username (English) : Y.Ueno<sup>1)</sup>  
所属名(日本語) : 1) イムラ・ジャパン株式会社  
Affiliation (English) : 1) IMRA JAPAN Co., Ltd.

## **1. 概要(Summary)**

弊社にて作製した薄膜サンプルについて光吸収係数等の光学定数測定や吸収スペクトル等の光学特性評価から目的の物性を有しているかどうか確認するため、貴学にご相談させていただいた結果、エリプソメトリーにおいて単層、多層薄膜の吸収スペクトル、膜厚を測定できることを教示いただいた。

特に、得られたスペクトルからエネルギーギャップを見積もる手法、エリプソメーター装置に実装されている解析ソフトの分析手法についての講義を受け、他の測定手法(一般的な分光光度計による測定)との実施方法や精度の違いについての議論を行った。デモ測定を元に、具体的な実験の進め方について検討させていただいた。

## **2. 実験(Experimental)**

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

## **3. 結果と考察(Results and Discussion)**

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

## **4. その他・特記事項(Others)**

なし

## **5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)**

なし

## **6. 関連特許(Patent)**

なし